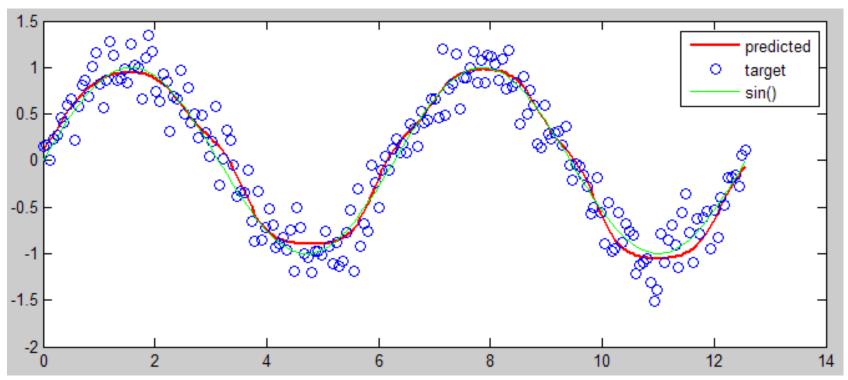
Wprowadzenie do Aproksymacji

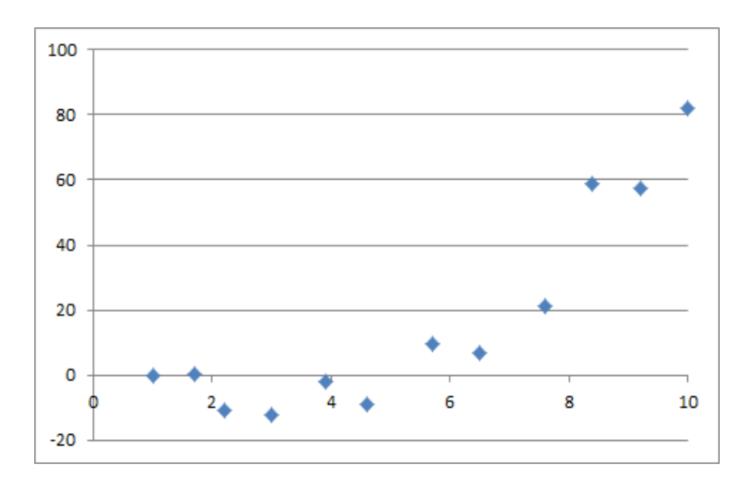
• Aproksymacja funkcji f(x) oznacza jej przybliżenie za pomocą innej, "prostszej" funkcji $\hat{f}(x)$.



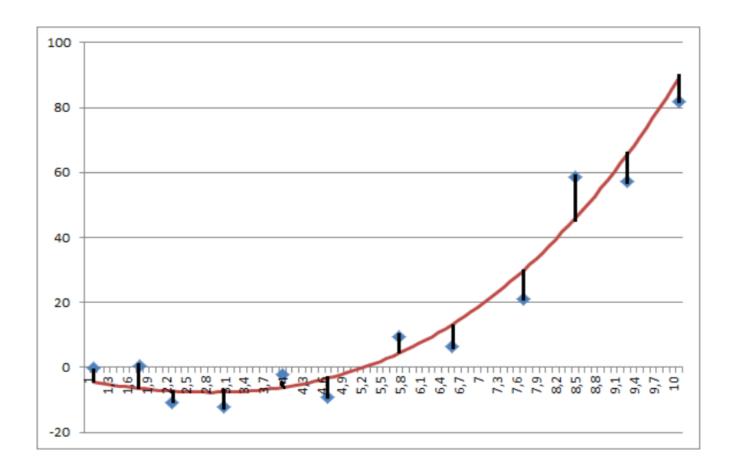
Źródło: https://stackoverflow.com/questions/1565115/approximating-function-with-neural-network

- Aproksymacja funkcji f(x) oznacza jej przybliżenie za pomocą innej, "prostszej" funkcji $\hat{f}(x)$.
- Dlaczego?
 - uproszczenie zagadnienia funkcja aproksymowana f(x) jest bardzo skomplikowana;
 - rozszerzenie zastosowań znamy tylko skończony zbiór wartości f(x).
- Co możemy aproksymować:
 - $f(x): \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
 - $f(x): \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$
 - $f(x): \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$

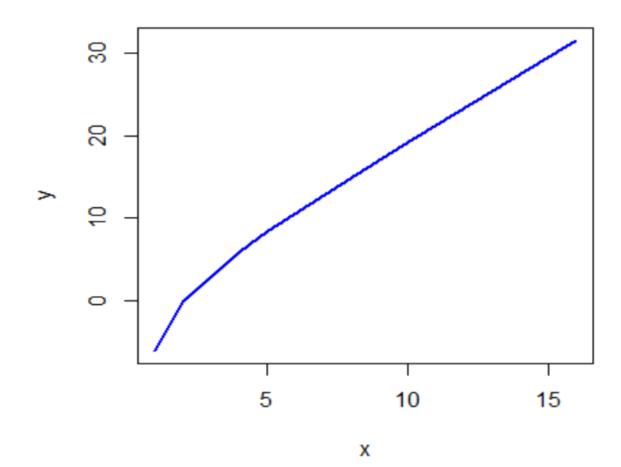
• Aproksymacja dyskretna:



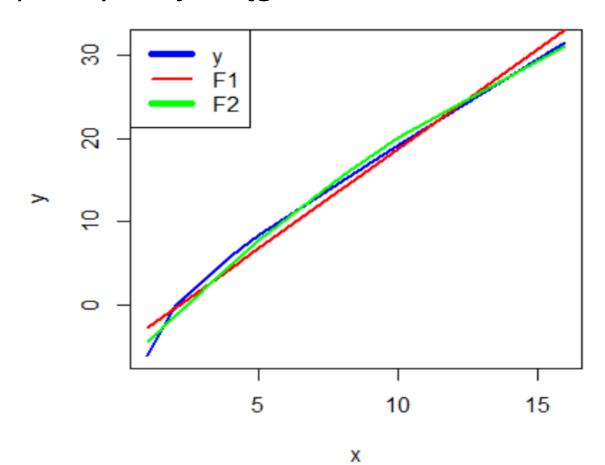
Aproksymacja dyskretna:



• Aproksymacja ciągła:



Aproksymacja ciągła:



 Zakładamy, że funkcja aproksymująca należy do ustalonej klasy funkcji np. uogólnionych wielomianów:

$$\hat{f}(x) = a_0 \phi_0(x) + a_1 \phi_1(x) + \dots + a_m \phi_m(x)$$

gdzie ϕ_0 to zadana z góry funkcja bazowa, która może mieć postać:

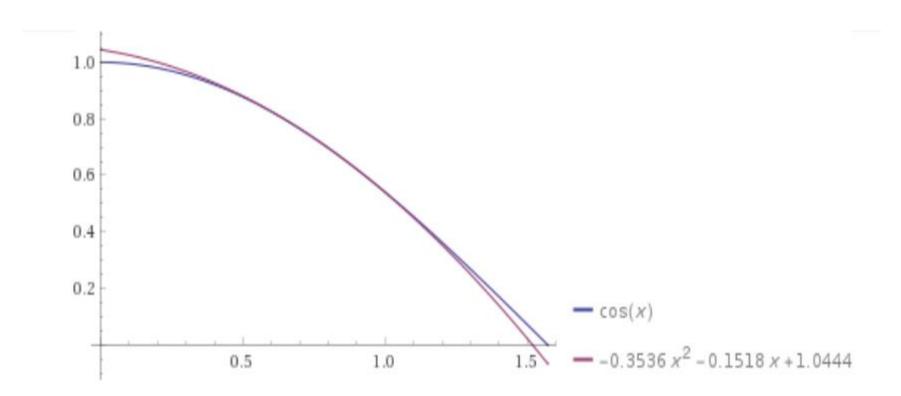
• Jednomianu

$$1, x, x^2, ..., x^m$$

- Wielomianu ortogonalnego
- Funkcji trygonometrycznej

$$1, \sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x, \dots, \sin mx, \cos mx$$

 Aproksymacja funkcji inherentnie wiąże się z pojawieniem się błędów, nazywanych błędami aproksymacji.



- Konieczne jest więc wprowadzenie miary, która pozwoli na mierzenie takiego błędu. Naturalnie chcemy żeby aproksymata $\hat{f}(x)$ minimalizowała taki błąd.
- W zależności od przyjętego błędu możemy mówić o aproksymacji jednostajnej:

$$||f(x) - \hat{f}(x)|| = \sup_{x \in [a,b]} |f(x) - \hat{f}(x)|$$

• Lub średniokwadratowej:

$$||f(x) - \hat{f}(x)|| = \int_{a}^{b} w(x) |f(x) - \hat{f}(x)|^{2} dx \text{ (przypadek ciągły)}$$

$$||f(x) - \hat{f}(x)|| = \sum_{i=1}^{n} w(x_{i}) |f(x_{i}) - \hat{f}(x_{i})|^{2} \text{ (przypadek dyskretny)}$$

- Możliwe są też inne metody obliczania błędu (np. Entropia)
- Wielkość błędów aproksymacji wpływa na wybór metody I funkcji aproksymujacej.

Twierdzenie Stone'a-Weierstrassa 1:

Jeżeli funkcja f(x) jest określona i ciągła na skończonym przedziale [a,b], to dla każdego $\epsilon>0$ istnieje takie n i wielomian $W_n(x)$ stopnia n, dla którego zachodzi nierówność:

$$|f(x) - W_n(x)| < \epsilon$$

na przedziale [a, b].

Twierdzenie Stone'a-Weierstrassa 2:

Jeżeli funkcja f(x) jest funkcją ciągłą i okresową w \mathbb{R} , o okresie 2π , to dla każdego $\epsilon>0$ istnieje taki wielomian trygonometryczny

$$S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n} (a_k \sin kx + b_k \cos kx)$$

dla którego zachodzi nierówność:

$$|f(x) - S_n(x)| < \epsilon$$

- Uczenie maszynowe (uczenie nadzorowane) może być traktowane jako specjalny, nietrywialny przypadek aproksymacji.
- Przede wszystkim, minimalizacja błędu musi odbywać się w sposób niejawny nie znamy rzeczywistej postaci funkcji f(x), tylko jej realizację $(x_1, y_1), (x_2, y_2), ..., (x_n, y_n) \sim \mathcal{D}$
- Aby rozwiązać takie zadanie, musimy posłużyć się funkcją kosztu $J(\alpha)$.

• Funkcje kosztu $J(\alpha)$ definiujemy zazwyczaj jako przeciętną wartość funkcji straty L:

$$J(\alpha) = \mathbb{E}_{(x,y) \sim \mathcal{D}} L(\hat{f}(x;\alpha), y)$$

gdzie \mathcal{D} to rozkład zmiennych x i y.

• Naszym celem jest **minimalizacja** funkcji $J(\alpha)$, czyli znalezienie takich parametrów α dla zadanej z góry rodziny funkcji \mathcal{F} dla których błąd będzie możliwie najniższy.

• Funkcje kosztu $J(\alpha)$ definiujemy zazwyczaj jako przeciętną wartość funkcji straty L:

$$J(\alpha) = \mathbb{E}_{(x,y) \sim \widehat{\mathcal{D}}} L(\hat{f}(x;\alpha), y)$$

gdzie $\widehat{\mathcal{D}}$ to empiryczny rozkład zmiennych x i y.

• Naszym celem jest **minimalizacja** funkcji $J(\alpha)$, czyli znalezienie takich parametrów α dla zadanej z góry rodziny funkcji \mathcal{F} dla których błąd będzie możliwie najniższy.

Pierwotna definicja uczenia statystycznego (Vapnik, 1999):

Dla zadanej klasy funkcji $\mathcal{F} = \{ \alpha \in \Lambda : \hat{f}(x, \alpha) \}$, procesu generującego dane $\mathcal{D} = (X, Y)$ oraz funkcji straty $L(Y, \hat{Y})$ należy rozwiązać problem:

$$\hat{\alpha} = \operatorname*{argmin}_{\alpha \in \Lambda} \left(\mathbb{E} \left(L(\hat{f}(x;\alpha),y) \right) \right)$$
 Na podstawie próby $(x_1,y_1), (x_2,y_2), \dots, (x_n,y_n)$

- Minimalizacja funkcji $J(\alpha)$ nie jest trywialnym zadaniem; musimy rozpatrzyć dwa potencjalne źródła błędu:
 - Błąd aproksymacji.
 - Błąd estymacji.
- Co więcej, zazwyczaj budujemy modele w celach prognostycznych.
- Musimy więc ocenić jaka jest skuteczność / poprawność aproksymacji na danych, które nie były wykorzystywane do budowy modelu.
- Błędy liczone na zbiorach treningowym i testowym mogą się znacznie różnić.
- Jak więc wybrać najlepszy model?

- Zadana klasa funkcji dopuszczalnych \mathcal{F} .
- Dla $\mathcal F$ można wyznaczyć wymiar Vapnika-Chervonenkisa $h(\mathcal F)$ mierzący jej zdolność dopasowania się do danych.
- Dysponujemy n-elementową próbą estymacyjną.
- Wybieramy funkcję $f \in \mathcal{F}$ minimalizującą błąd na danych estymacyjnych R_e .
- Chcemy oszacować błąd prognozy R_p :

Twierdzenie (Vapnik, 1995):

Dla dowolnego rozkładu (X, Y) i klasy funkcji $\mathcal F$ z prawdopodobieństwem 1-q zachodzi zależność:

$$R_p \le R_e + \underbrace{\sqrt{\frac{h(\mathcal{F})(1 + \ln(2n/h(\mathcal{F}))) - \ln(q/4)}{n}}}_{\epsilon}$$

• Dla zadanego zbioru przykładów $C = \{c_1, c_2, c_3, ..., c_n\} \in X$ możemy zdefiniować klasyfikator f jako funkcję która dla każdego podzbioru $C' \subseteq C$ (**każdej klasy**) pozwala przypisać mu odpowiednią etykietę:

$$f(c) = \begin{cases} 1 & c \in C' \\ 0 & c \notin C' \end{cases}$$

• Dla zadanego zbioru przykładów $C = \{c_1, c_2, c_3, ..., c_n\} \in X$ możemy zdefiniować klasyfikator f jako funkcję która dla każdego podzbioru $C^{'} \subseteq C$ (**każdej klasy**) pozwala przypisać mu odpowiednią etykietę:

$$f(c) = \begin{cases} 1 & c \in C' \\ 0 & c \notin C' \end{cases}$$

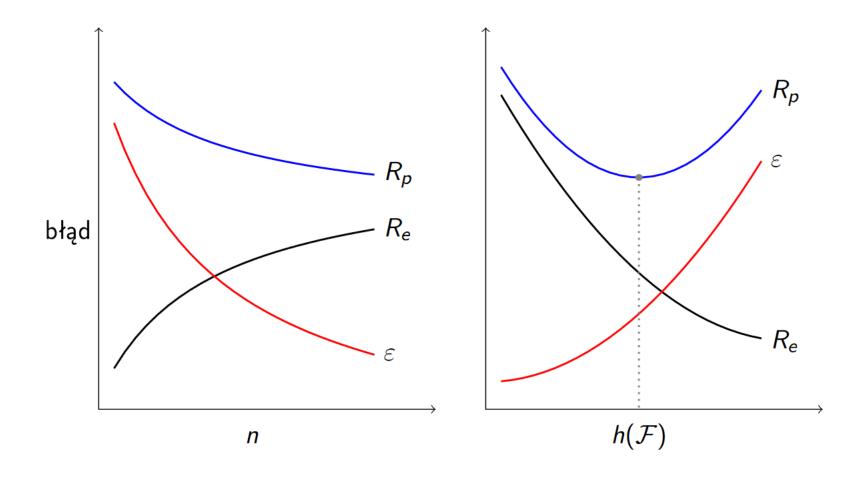
• Mówimy, że klasa funkcji \mathcal{F} rozdziela (shatters) zbiór \mathcal{C} jeżeli istnieje taka funkcja $f \in \mathcal{F}$, że dla przyporządkowania $\mathcal{F}_{\mathcal{C}} = \{(f(c_1), f(c_2), \dots, f(c_n)) | f \in \mathcal{F}\}$ moc zbioru $|\mathcal{F}_{\mathcal{C}}| = 2^{|\mathcal{C}|}$.

• Dla zadanego zbioru przykładów $C = \{c_1, c_2, c_3, ..., c_n\} \in X$ możemy zdefiniować klasyfikator f jako funkcję która dla każdego podzbioru $C' \subseteq C$ (każdej klasy) pozwala przypisać mu odpowiednią etykietę:

$$f(c) = \begin{cases} 1 & c \in C' \\ 0 & c \notin C' \end{cases}$$

- Mówimy, że klasa funkcji \mathcal{F} rozdziela (shatters) zbiór \mathcal{C} jeżeli istnieje taka funkcja $f \in \mathcal{F}$, że dla przyporządkowania $\mathcal{F}_{\mathcal{C}} = \{(f(c_1), f(c_2), \dots, f(c_n)) | f \in \mathcal{F}\}$ moc zbioru $|\mathcal{F}_{\mathcal{C}}| = 2^{|\mathcal{C}|}$.
- Intuicyjnie oznacza to, że funkcja f poprawnie przyporządkowuje etykiety na wszystkie 2^n sposobów niezależnie od tego w jaki sposób są one początkowo przydzielone (jaka próbka C została wylosowana).

- Wymiar Vapnika-Chervonenkisa $h(\mathcal{F})$ klasy funkcji \mathcal{F} definiujemy jako rozmiar największego zbioru $C \in X$ jaki jesteśmy w stanie rozdzielić za pomocą \mathcal{F} .
- Gdy możemy rozdzielić dowolny zbiór (nasz klasyfikator jest idealny) wtedy $h(\mathcal{F})=\infty$.



 Obciążenie – błąd aproksymacji wynikający z uproszczenia rzeczywistej zależności. Im większe uproszczenie, tym większe obciążenie.

$$Bias(\hat{f}(x)) = \mathbb{E}(\hat{f}(x)) - f(x)$$

• Obciążenie i złożoność funkcji aproksymujących są odwrotnie proporcjonalne.

• Wariancja modelu – zakres zmian wartości funkcji aproksymującej \hat{f} dla różnych zbiorów treningowych. Duża wariancja oznacza, że nawet małe zmiany w danych treningowych mogą powodować duże zmiany wartości aproksymacji \hat{f} .

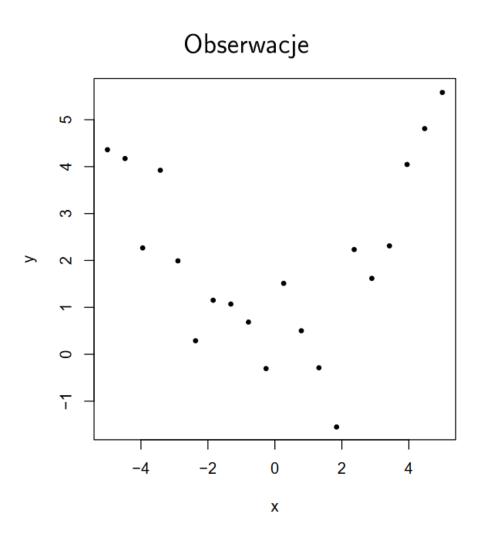
$$\operatorname{Var}\left(\hat{f}(x)\right) = \mathbb{E}\left(\hat{f}(x)\right)^{2} - \left[\mathbb{E}\left(\hat{f}(x)\right)\right]^{2}$$

 Wariancja i złożoność funkcji aproksymujących są wprost proporcjonalne.

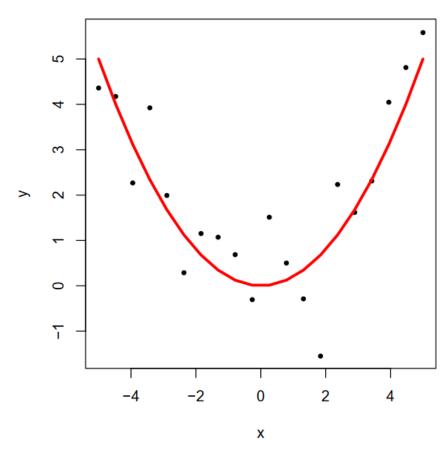
Błąd aproksymacji jest równy:

$$\mathbb{E}\left(\hat{f}(x) - f(x)\right)^2 = \left[Bias\left(\hat{f}(x)\right)\right]^2 + \operatorname{Var}\left(\hat{f}(x)\right) + \sigma^2$$

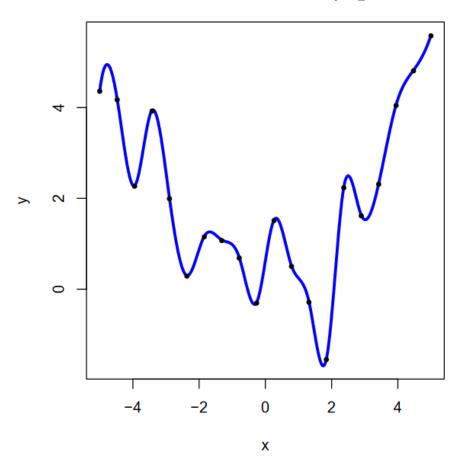
gdzie σ^2 to wariancja składnika losowego.



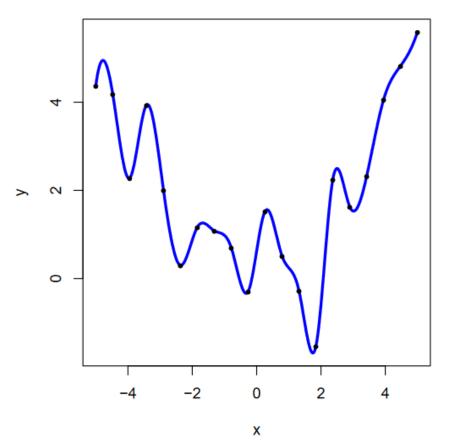
proces generujący dane: $y = x^2/5 + \varepsilon$, gdzie $\varepsilon \sim N(0,1)$



Dwukrotnie różniczkowalna funkcja $f : \sum_{i=1}^n (f(x_i) - y_i)^2 o \min$



Dwukrotnie różniczkowalna funkcja $f: \sum_{i=1}^n (f(x_i) - y_i)^2 \to \min$

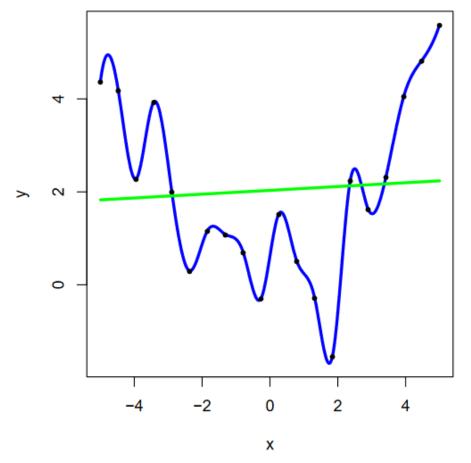


zagnieżdżona klasa funkcji: wygładzane funkcje sklejane (Hastie et al., 2001)

Dwukrotnie różniczkowalna funkcja f: $\sum_{i=1}^{n} (f(x_i) - y_i)^2 \to \min, \text{ p.w. } \int_{D} [f''(x)]^2 dx \leq \delta$

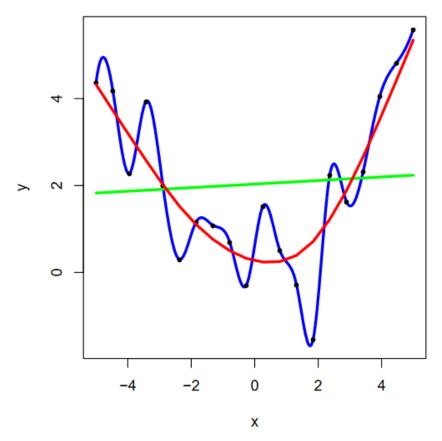
niebieski: $\delta \to +\infty$

Dwukrotnie różniczkowalna funkcja f: $\sum_{i=1}^{n} (f(x_i) - y_i)^2 \to \min, \text{ p.w. } \int_{D} [f''(x)]^2 dx \leq \delta$



niebieski: $\delta \to +\infty$, zielony: $\delta = 0$

Dwukrotnie różniczkowalna funkcja f: $\sum_{i=1}^{n} (f(x_i) - y_i)^2 \to \min, \text{ p.w. } \int_{D} [f''(x)]^2 dx \leq \delta$



niebieski: $\delta \to +\infty$, zielony: $\delta = 0$, czerwony: δ optymalne

Wybieramy rodzinę zagnieżdżonych klas funkcji:

$$\mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_2 \subset \mathcal{F}_3 \subset \dots$$

$$\downarrow h(\mathcal{F}_1) \leq h(\mathcal{F}_2) \leq h(\mathcal{F}_3) \leq \dots$$

• Wyznaczamy:

$$R_e(\mathcal{F}_1) \ge R_e(\mathcal{F}_2) \ge R_e(\mathcal{F}_3) \ge \dots$$

 $\varepsilon(\mathcal{F}_1) \le \varepsilon(\mathcal{F}_2) \le \varepsilon(\mathcal{F}_3) \le \dots$

• Wybieramy model oszacowany na podstawie klasy funkcji \mathcal{F}_i minimalizującej oszacowanie R_p .

- Ograniczenia twierdzenia Vapnika:
 - Trudność z wyznaczeniem wartości $h(\mathcal{F})$ dla złożonych klas funkcji
 - Nierówność z twierdzenia jest bardzo konserwatywna
- W praktyce stosujemy zwykle procedury alternatywne:
 - kryteria informacyjne (AIC, BIC,...)
 - Zbiór walidacyjny
 - Walidacja krzyżowa
 - bootstrapping